



## Программа семинара

### ПРИБОРЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ МЕТАЛЛОГРАФИИ

28-29 мая 2015, Екатеринбург

Место проведения семинара: Екатеринбург, ул.Мира, 21, Физико-технический факультет Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, ауд. ФТ-214

#### 28 мая (четверг)

9.00 – 9.30 Регистрация слушателей

9.30 – 9.50 Инновационные приборы и решения компании SIAMS в области автоматической металлографии.

*Козерчук А.Л., зам. директора ООО «СИАМС»*

9.50 - 10.10 SIAMS 800 – анализатор микроструктур нового поколения.

*Сивкова Т.А., ведущий специалист металлографического направления ООО «СИАМС»*

20 мин Кофе-брейк

10.30 – 12.00 Демонстрация Анализатора SIAMS 800:

- Технологии получения панорамных изображений микроструктуры из видеопотока
- Технологии выравнивания освещенности поля
- Технологии фокусировки неплоской поверхности образца из видеопотока
- Экспресс-оценка микроструктуры
- Автоматизированные методики
- Интерактивные измерения параметров структуры
- Цифровая система для создания тематических атласов
- Электронный лабораторный журнал

*Сыропятов А.С., руководитель отдела информационных систем ООО «СИАМС»*

1 час Перерыв на обед

13.00– 13.20 Автоматизация металлографических микроскопов. Программа переоснащения  
*Нурканов Е.Ю., к.т.н., зам. начальника отдела ООО «СИАМС»*

13.20 – 14.20 Опыт использования Анализатора SIAMS 800 для автоматического анализа панорамных изображений микроструктуры различных металлов и сплавов.

*Петров М.С., руководитель отдела систем анализа изображений ООО «СИАМС»*

20 мин Кофе-брейк

14.40 – 15.10 Приборы компании SIAMS для компьютерной металлографии.

*Сыропятов А.С., руководитель отдела информационных систем ООО «СИАМС»*

15.10 – 16.30

- Презентации и «тест-драйв» демонстрационного оборудования для цифровой микроскопии

- Консультации сервисных инженеров компании SIAMS

**29 мая (пятница)**

**Приборы компании SIAMS для компьютерной металлографии**

**9.00 – 9.20**      Переносной Анализатор Ресурс С7 – эффективное решение для неразрушающего металлографического контроля оборудования в процессе эксплуатации  
*Акрамов М.В., сервисный специалист ООО «СИАМС»*

**Нормативно-правовая поддержка Анализаторов SIAMS. Метрологические аспекты**

**9.20 – 9.40**      Метрологическое обеспечение SIAMS 800  
*Михайлович А.П., руководитель отдела проектирования ООО «СИАМС»*

**Современные информационные технологии для производственных предприятий. Учет, планирование, аналитика с помощью ПО SIAMS**

**9.40 – 10.30**      Интеллектуальные аналитические системы SIAMS  
*Мизгулин В.В., к.т.н, ведущий менеджер Высшей инженерной школы УрФУ, руководитель отдела перспективных разработок ООО «СИАМС»*  
Новый класс информационных систем в промышленности – системы диспетчерского управления. SIAMS-Диспетчерское управление (SIAMS-ДУ)  
*Ефремов С.А., зам. директора по управлению проектами ООО «СИАМС»*

**20 мин**          Кофе-брейк

**Сервисная поддержка SIAMS**

**10.50 – 11.20**      Система обучения и сервисной поддержки SIAMS.  
*Петров М.С., руководитель отдела систем анализа изображений ООО «СИАМС»*

**11.20 – 12.00**      Критерии выбора оптических микроскопов и оборудования для подготовки металлографических образцов  
*Нурканов Е.Ю., к.т.н., зам. начальника отдела ООО «СИАМС»*

**Подведение итогов семинара**

**12.00 – 13.00**      • «Тест-драйв» демонстрационного оборудования для цифровой микроскопии  
• Консультации сервисных инженеров компании SIAMS  
• Выдача именных сертификатов участникам семинара